

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC
115-1

QC 400000

1982

AMENDEMENT 4
AMENDMENT 4

1993-03

Amendement 4

**Résistances fixes utilisées dans
les équipements électroniques**

Partie 1:
Spécification générique

Amendment 4

**Fixed resistors for use in
electronic equipment**

Part 1:
Generic specification

© CEI 1993 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

E

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

PREFACE

La présente modification a été établie par le Comité d'Etudes No. 40 de la CEI: Condensateurs et résistances pour équipements électroniques.

Le texte de cette modification est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois	Rapport de vote
40(BC)758	40(BC)798

Pour de plus amples renseignements, consulter le rapport de vote correspondant mentionné dans le tableau ci-dessus.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de spécification dans le Système CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ).

IEC 60115-1 am4 Ed. 2.0 - Preview only Copy via ILNAS e-Shop

Page 16

Ajouter les nouvelles définitions suivantes:

2.2.22 Résistance à radiateur

Type de résistance conçu pour être monté sur un radiateur séparé.

2.2.23 Dissipation nominale (résistances à radiateur uniquement)

La dissipation maximale admissible d'une résistance à radiateur est la dissipation maximale admissible à une température ambiante de 25 °C lorsqu'elle est montée sur le radiateur de référence, dans les conditions de l'essai d'endurance à la température ambiante applicable aux résistances à radiateurs qui entraînera une variation de la résistance inférieure ou égale à celle spécifiée pour cet essai d'endurance.

2.2.24 Température maximale normale

Température maximale fixée en un point quelconque de la résistance dans des conditions de fonctionnement quelconques admissibles.

Page 58

Remplacer le paragraphe 4.25.2 par:

4.25.2 Endurance à température ambiante.

4.25.2.1 La résistance doit être mesurée comme spécifié au paragraphe 4.5.

4.25.2.2 Les résistances doivent être soumises à un essai d'endurance de 42 jours (1 000 h) à une température ambiante comprise entre 15 °C et 35 °C. Si requis dans la spécification particulière, la durée de l'essai peut être prolongée (voir paragraphe 4.25.2.7).

PREFACE

This amendment has been prepared by IEC Technical Committee No. 40: Capacitors and Resistors for Electronic Equipment.

The text of this amendment is based upon the following documents:

Six Months' Rule	Report on Voting
40(CO)758	40(CO)798

Further information can be found in the relevant Report on Voting indicated in the table above.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

Page 17

Add the following new definitions:

2.2.22 Heat-sink resistor

A resistor type designed for mounting on a separate heat-sink.

2.2.23 Rated dissipation (heat-sink resistors only)

The maximum allowable dissipation of a heat-sink resistor at an ambient temperature of 25 °C, when mounted on the reference heat-sink, under the conditions of the endurance test at room temperature for heat-sink resistors, and which will result in a change in resistance not greater than that specified for this endurance test.

2.2.24 Maximum element temperature

The maximum stated temperature at any point on or within the resistor under any permissible operating condition.

Page 59

Replace the present Subclause 4.25.2 by the following:

4.25.2 Endurance at room temperature.

4.25.2.1 The resistance shall be measured as specified in Subclause 4.5.

4.25.2.2 The resistors shall be subjected to an endurance test of 42 days (1 000 h) at an ambient temperature of between 15 °C and 35 °C. When required by the detail specification, the duration of the test may be extended (see Subclause 4.25.2.7).